

## Anmeldung

17. Juni 2004  
Heinz Nixdorf MuseumsForum – Paderborn

Bitte senden Sie die Anmeldung bis spätestens 30. Mai 2004 zum Fraunhofer IZM.

---

Firma

---

Name

---

Position

---

Adresse

---

Email

---

Telefon

---

Fax

---

Datum

---

Unterschrift

## Anmeldung

17. Juni 2004  
Heinz Nixdorf MuseumsForum - Paderborn

---

**Allgemeine Leitung**  
Heiko Köhne

---

**Veranstaltungsort**  
Heinz Nixdorf MuseumsForum  
Fürstenallee 7  
33102 Paderborn

---

### Anmeldung

Anmeldeschluss : 30.05.2004  
max. Teilnehmerzahl : 25  
Teilnahmegebühr : € 95,- incl. Mittag

Bitte senden Sie die Anmeldung per Fax oder Email an:

Fraunhofer - IZM, Berlin  
Frau Karen Malz  
Fax.: +49.30.46 40 31 58  
eMail: ase-sek-b@izm.fraunhofer.de

---

### Anfragen an

technisch:  
Heiko Köhne Phone: +49.30.46403-145  
email: heiko.koehne@izm.fhg.de

organisatorisch :  
Karen Malz Phone: +49.30.46403-144  
email: ase-sek-b@izm.fhg.de

## Workshop

# IC basierte Elektromagnetische Verträglichkeit von Mikrosystemen

17. Juni 2004 - @ HNF - Paderborn

Für die Betrachtung von Fragestellungen der Elektromagnetischen Verträglichkeit bei elektronischen Systemen spielen Integrierte Schaltkreise sowohl als Störquelle als auch als Störsenke eine wichtige Rolle.

Schaltvorgänge auf ICs führen zu leitungsgebundenen Störungen, welche auf Gehäuse und Leiterplatten-ebene zu Fehlfunktionen, bzw. zu elektromagnetischen Emissionen führt.

Umgekehrt können eingestrahlte oder leitungsgebundene Störungen Fehlfunktionen, bzw. sogar irreversible Schäden in ICs hervorrufen.

Daraus ergeben sich Forschungs Herausforderungen, denen sich die Mitarbeiter des noch jungen Arbeitsgebietes *Elektromagnetische Verträglichkeit auf IC Ebene* stellen.

Wir möchten Sie einladen zu einem Workshop, der sowohl den IC-, bzw. ASIC-Entwickler als auch den Schaltungs- und Systementwickler als IC-Anwender anspricht.

Neben dem Einblick in aktuelle Forschungsarbeiten stehen Erfahrungen aus der Praxis im industriellen EMV-Alltag im Mittelpunkt der Veranstaltung.



**Fraunhofer** Institut  
Zuverlässigkeit und  
Mikrointegration

# Workshop Programm

**Registrierung: ab 9<sup>00</sup>**

**Beginn: 10<sup>00</sup>**

## Moderation

Heiko Köhne (IZM)

## 10<sup>00</sup>: Begrüßung

Werner John (IZM)

## 10<sup>15</sup>: EMV auf Chipebene als Forschungsthema

Heiko Köhne (IZM)

## 11<sup>00</sup> – 11<sup>15</sup>: Pause

## 11<sup>15</sup>: Emissionsanalyse von digitalen ICs

Michael Schmidt (IZM)

## 12<sup>00</sup> – 12<sup>45</sup>: Mittagspause

## 12<sup>45</sup>: Blitzableiter für IC's -

## Schutz vor Elektrostatischer Entladung (ESD)

Gerhard Groos (Infineon)

## 13<sup>30</sup>: Störfestigkeitsanalyse digitaler ICs gegenüber hochenergetischen Impulsen

Haiko Morgenstern (IZM)

## 14<sup>15</sup> – 14<sup>30</sup>: Pause

## 14<sup>30</sup>: Störfestigkeitsanalysen von analogen Mikrosystemen

Uwe Stürmer (IZM)

## 15<sup>15</sup>: EMC at the IC Level, as an Integral Approach

Mart Coenen (Philips)

## 16<sup>00</sup>: Abschluss

**Ende: 16<sup>15</sup>**

Vorträge ca. je 30min. +15min. Diskussion



Fraunhofer IZM Berlin

# Anfahrt

## Auto

Autobahn A33, Abfahrt „Paderborn Zentrum“, Richtung Paderborn

Kostenlose Parkplätze vor dem HNF

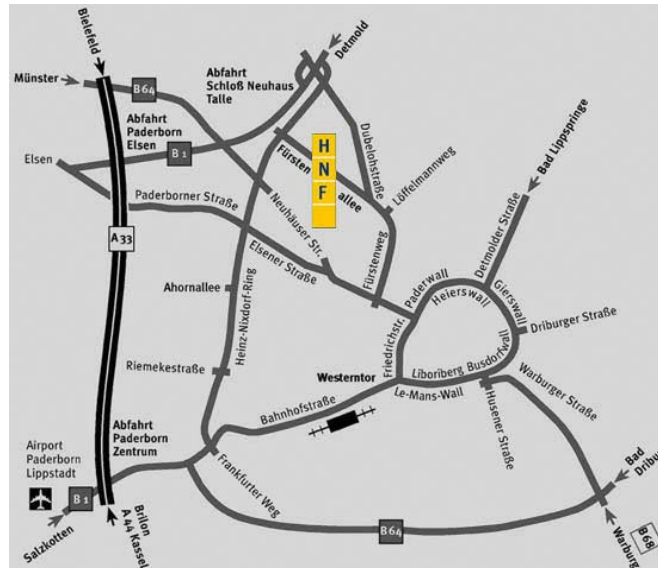
## Bahn

Ab Hauptbahnhof Paderborn Buslinie 11 bis Haltestelle MuseumsForum

Oder ab nächstgelegenen IC/ICE-Bahnhöfen Bielefeld, Hamm und Kassel-Wilhelmshöhe mit dem Mietwagen.

## Flugzeug

Ab Flughafen Paderborn Lippstadt mit dem Taxi



Firmenstempel

Fraunhofer Institut für  
Zuverlässigkeit und Mikrointegration  
Ms. Karen Malz

Gustav-Meyer-Allee 25  
D-13335 Berlin  
Germany